

【化学分析】

ICP発光分光分析装置・ICP質量分析装置

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
ICP発光分光分析装置(ICP-AES)	依頼	基本利用料	装置起動及び保守に伴う諸経費	10,000円 / 1式			
		通常測定	定性・定量測定	6,000円 / 1試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
		試料前処理	各種溶媒およびマイクロウェーブ前処理装置による前処理	4,000円 / 1試料			
ICP質量分析装置(ICP-MS)	依頼	基本利用料	装置起動及び保守に伴う諸経費	10,000円 / 1式			
		通常測定	定性・定量測定	6,000円 / 1試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
		試料前処理	各種溶媒およびマイクロウェーブ前処理装置による前処理	4,000円 / 1試料			

エネルギー分散型蛍光X線分析装置

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	依頼	基本利用料	装置起動及び保守に伴う諸経費	10,000円 / 1式			
		通常測定	定性・定量測定	2,000円 / 1試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	

質量分析装置

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
MALDI-TOF/TOF-MS(ナノLC付)	依頼	通常測定		8,500円/試料			
		PMF測定		12,500円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	マトリックス3種まで4種目からは27,000円×マトリックス数を追加
		追加測定	MALDI測定に加えESI,JMS700でも測定の場合	6,000円/試料+			
ESI-TOF-MS(LC付)	依頼	通常測定		8,500円/試料+			*1イオン化につき
		高分解能測定		10,500円/試料+			*1イオン化につき
		LO-MS測定		23,000円/試料+	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	*1イオン化につき、事前打ち合わせ必要
		追加測定	ESI測定に加えMALDI,JMS700での通常測定	6,000円/試料+			*1イオン化につき
		追加測定	microTOF IIにてイオン源変更での測定	6,000円/試料+			*1イオン化につき

二重収束型質量分析装置

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
二重収束型質量分析装置 磁場型MS JMS-700	依頼	通常測定	Ei (DD, FAB (pos/nega), FD・低分解能	7,500円/試料+			*1イオン化につき
		高分解能測定	Ei (DD, FAB (pos/nega)・高分解能	9,500円/試料+	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	*1イオン化につき
		追加測定	JMS700でイオン源変更での高分解能測定	6,000円/試料+			*1イオン化につき
		追加測定	JMS700の測定に加え、MALDIESIでの測定	8,000円/試料+			*1イオン化につき
		消耗品	FDエミッタ	16,500円/個	16,500円/個	16,500円/個	

元素分析装置

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
元素分析装置	依頼	通常測定	JM10: CHN分析	8,000円/測定			
			VarioELcube: CHN分析	8,000円/測定	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
			VarioMicrocube: O分析	8,000円/測定			

熱分析装置

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
DTG-60	依頼	通常測定	固体(粉体・フィルム)600℃まで1回測定: アルミオープン容器	5,000円/測定			
			固体(粉体・フィルム)アルミナセル使用 1000℃まで1回測定	6,000円/測定			
			固体(粉体・フィルム)プラチナセル使用 1000℃まで1回測定	7,000円/測定			
			オイル・スラリー・特殊試料	5,000円/追加	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	液体、揮発性物質等は測定不可 (特殊な場合はオイル・スラリー代として加算)
			LiI (プラチナ・アルミナ)	3,000円/測定			固体・フィルム代に加算
			ホルド	1,000円/時間			
			空焼き(測定前および測定中必要と思われた時)	3,000円/回			
		その他	ブランク測定料	測定と同額/回			
ThermoMass	依頼	通常測定	固体(粉体・フィルム)500℃まで1回測定: EI法またはPI法、アルミオープン容器	8,000円/測定			
			固体(粉体・フィルム)1000℃まで1回測定: EI法またはPI法、アルミナセルまたは石英セル使用	9,000円/測定			
			固体(粉体・フィルム)1000℃まで1回測定: EI法またはPI法、プラチナセル使用	10,000円/測定			
			オイル・スラリー・特殊試料	5,000円/追加	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	液体、揮発性物質等は測定不可 (特殊な場合はオイル・スラリー代として加算)
			プラチナLiI使用	3,000円/測定			固体・フィルム代に加算
			ホルド	5,000円/時間			
			使用開始前ベーキング	10,000円/回			
		その他	空焼き(測定前および測定中必要と思われた時)	5,000円/回			
マイクロ電子天秤	依頼	計量		800円/計量	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
		解析・分析相談		1,200円/時間	2,500円/時間	2,500円/時間	
示差走査熱量測定装置(DSC8500)	依頼	通常測定		6,000円/件	12,000円/件	12,000円/件	
		消耗品		実費/件	実費の2倍/件	実費の2倍/件	

【顕微分析】

電界放出形走査電子顕微鏡 FE-SEM

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
FE-SEM (S-5500)	依頼	依頼測定	観察(SE像、BSE像、STEM像)	10,000円/時間			
			前処理	300円/10分	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	
			特殊前処理	2,000円/試料			
			データ処理	800円/30分			
			消耗品	実費相当			

電界放出形走査電子顕微鏡 FE-SEM

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
FE-SEM (JSM-IT100)	依頼	依頼測定	測定	12,000円/試料			
			追加時間	6,000円/時間			
			立金(2時間以降)	8,000円/30分	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
			前処理	400円/10分			
			特殊前処理	2,000円/試料			
			データ処理	1,000円/30分			
			消耗品	実費相当			

分析走査電子顕微鏡 SEM

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
SEM (JSM-6610LA)	依頼	依頼測定	試料観察	5,000円/時間			
			EDS分析加算	1,000円/時間			
			前処理	300円/10分	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	
			特殊前処理	2,000円/試料			
			データ処理	800円/30分			
			消耗品	実費相当			

走査型電子顕微鏡 SEM

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
SEM (JSM-IT100)	依頼	依頼測定	観察	3,000円/時間			
			前処理	400円/10分	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
			特殊前処理	2,000円/試料			
			消耗品	実費相当			

電界放出形透過電子顕微鏡

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
FE-TEM (JEM-Z100F)	依頼	依頼測定	TEM/STEM観察・EDS分析	15,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	
			EELS分析加算	5,000円/時間			
			データ処理	1,000円/30分			
			特殊ホルダーによる測定加算	10,000円~/回			*要事前相談
			前処理	300円/10分			
			特殊前処理	2,000円/試料			
			消耗品	実費相当			

透過電子顕微鏡

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
TEM (JEM-1400)	依頼	依頼測定	試料観察	10,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	
			前処理	300円/10分			
			特殊前処理	2,000円/試料			
			データ処理	800円/30分			
			消耗品	実費相当			

FIB-SEM

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
FIB-SEM(JIB-4500)	依頼	依頼加工	加工	12,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
			3次元構造解析(3時間まで)	36,000円/試料			
			3次元構造解析時間延長	6,000円/時間			
			3次元再構築	6,000円/試料			
			TEM試料作製(試料幅5μm)	50,000円/試料			
			TEM試料作製(試料幅10μm)	60,000円/試料			
			TEM試料作製(試料幅12.5μm)	70,000円/試料			
			TEM試料作製(断面式)	56,000円/試料			
			SEMデポジション	4,000円/回			
			消耗品	実費相当			

ウルトラミクロトーム

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
ウルトラミクロトーム (UC8, FC8)	依頼	依頼測定	染色	2,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	
			樹脂包埋	1,000円/試料			
			ガラスナイフ切削	5,000円/試料			
			ダイヤモンドナイフ切削(トリミング込)	20,000円/試料~			
			クライオ・ウルトラミクロトーム	20,000円/時間~			
	消耗品		カミソリ	100円/個			
			ガラスナイフ	100円/個			
			ポート付ガラスナイフ	200円/個			
			その他消耗品	実費相当			

精密イオンポリッシング

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
精密イオンポリッシング (Gatan Model691)	依頼	依頼加工	加工	9,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
			TEM試料作製(イオンミリング法)	60,000円/試料			

ディンプルグラインダー

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
ディンプルグラインダー (Gatan Model656)	依頼	依頼加工	加工	3,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	

ディスクグラインダー

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
ディンプルグラインダー (Gatan Model623)	依頼	依頼加工	加工	3,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	

精密切断

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
精密切断 (IsoMet)	依頼	依頼加工	加工	3,000円/時間	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	

真空蒸着

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
真空蒸着 (JEE420)	依頼	依頼加工	成膜	3,000円/回	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	

カーボンコーター

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
カーボンコーター (CADE-E)	依頼	依頼加工	成膜または観水化処理	3,000円/回	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	

イオンコーター

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
イオンコーター (IB-3)	依頼	依頼加工	成膜または観水化処理	6,000円/回	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	1回あたり放電時間10分まで

イオンスパッタコーター

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
イオンスパッタコーター (MC1000)	依頼	依頼測定	試料前処理	2,000円/30秒	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	

プラズマイオンコーター

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
プラズマイオンコーター (MSP-1S)	依頼	通常測定	試料前処理	2,000円/30秒	成果公開の1.5倍	成果公開の2倍	

【光分析】

時間分解吸収分光解析システム

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
時間分解吸収分光解析システム (TRASAS)	依頼	依頼測定	蛍光寿命	3,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	
			透過吸収	6,000円/試料			

分光エリプソメーター

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
分光エリプソメーター (ELC300)	依頼	依頼測定	測定	3,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	測定のみで解析します

【X線回折】

粉末X線回折計

装置名称	区分(セルフ付依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
粉末X線回折計(XRD) Ultima IV	依頼	通常測定	1サンプル1回測定 X線回折測定と相関定	5,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	1試料2時間以上の測定の場合、追加料金あり
			1サンプル1回測定 X線回折測定と相関定および応用解析	7,000円/試料			
			特殊試料および測定	10,000円/追加			
			XRD-DSC測定	15,000円/試料			1サンプル2回測定まで
			ブランク測定	15,000円/回			

粉末X線回折計 (XRD-DSC)	依頼	通常測定	1サンプル1回測定 X線回折測定と相測定 (標準試料台)	5,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の3倍	1試料2時間以上の測定の場合、追加料金あり
			1サンプル1回測定 X線回折測定と相測定および応用解析	7,000円/試料			
			特殊試料および測定	10,000円/追加			
	消耗品		Al ₂ O ₃	実費相当/個	実費相当(1,500円/個)	実費相当(1,500円/個)	リファレンス用も加算
			液体窒素	実費相当/日	実費相当(2,000円)/日	実費相当(2,000円)/日	低温測定時のみ
薄板X線回折装置 SmartLab	依頼	依頼測定	基本測定	5,000円/試料	成果公開の1.5倍	成果公開の1.5倍	測定時間に応じて2000円/時間を加算
			特殊測定	要相談			
	その他	解析分析相談	基本測定	3,000円/件・コース			
			特殊測定	6,000円/件・コース			
			消耗品	実費相当	実費の2倍	実費の2倍	

*コースは別紙参照

送料

装置名称	区分(セルフ依頼)	分析項目	分析内容・詳細	金額(成果公開)	金額(成果非公開)	金額(利用非公開)	備考
送料	依頼	送料	レターパックライト代(実費)	実費	実費	実費	サンプル返却時の送料